



SCREEN

SCREENインテリジェンスシステムで
検査を変える

検査 + AI

講演

11月1日(金)
12:35-14:50 C-2

<The半導体> 装置技術・プロセス技術

「AIで切り拓く先端欠陥検査技術の開発」AS・開発部 開発担当課長 岡山 敏之